

A4

W300×D215×H100mm

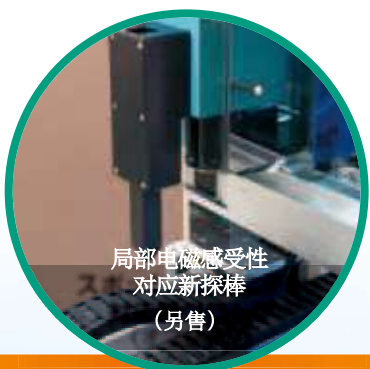
EMI+EMS
EMC
 简单&高精度
 全自动检测

8G

业界初 150kHz~8GHz

通过**局部电磁感受性功能** 真正**EMC**对
应 正交+4轴旋转※全方位干扰检测标准样机

※ X轴・Y轴・Z轴+θ轴：旋转轴



频率带宽
150kHz~3GHz
150kHz~8GHz
 CISPR22对应

业界首次!!※

※ 搭载局部照射功能探棒的EMC干扰扫描仪



专利 第5574482号

工程师期盼的EMC干扰扫描仪

High Performance EMC Noise Scanner **WM7000**系列

WM 7400



森田テック株式会社

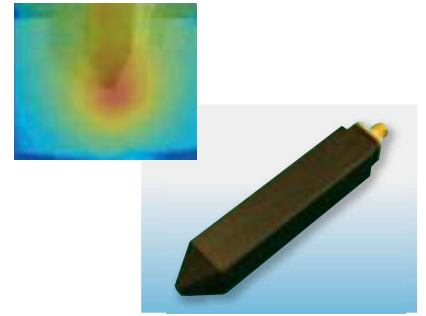
工程师期盼的3个理由

能够实现EMI+EMS的“真正EMC”



通过装备具有我公司自行研发的局部电磁感受性功能的磁界·电界探棒『MT-676电磁波照射探棒（另售）』，可实现近磁界·电界的电磁波检知（EMI）和受电磁波照射的「局部电磁耐性试验」。无论是在产品的检测中，还是电子设备的设计阶段，可以较为容易的锁定电磁波耐性强的地方和清楚电磁波妨害发生的机制。

- ※ EMC (Electro-Magnetic Compatibility) : 电磁兼容性
- ※ EMI (Electro-Magnetic Interference) : 电磁妨害·放射 (干扰性)
- ※ EMS (Electro-Magnetic Susceptibility) : 电磁感受度·耐性 (抗干扰性)

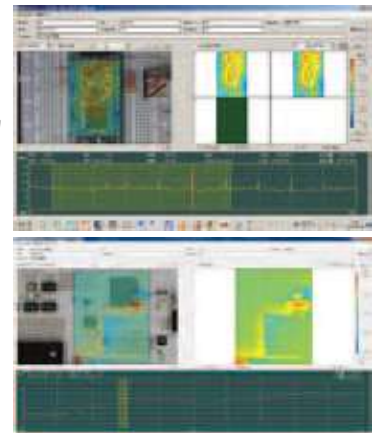
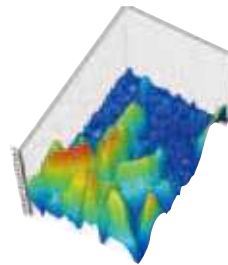


新开发『MT-676电磁波照射探棒』(上图)。通过从照射部位(直径1.6mm)对电磁波进行照射,实现对电子部件精确到点的电磁耐性试验。左上图为MT-676电磁波照射探棒的放射图形。



通过专用软件使干扰图像化 使干扰和EMS发生源一目了然

通过专用软件的使用,可以实现对常规设备产生的电磁干扰高效准确的测定。将测定物体的照片和干扰图重叠,干扰发生源将变得一目了然。在电磁感受性的试验中,通过同样的软件,也可实现对电磁感受性发生的固有场所的可视化。

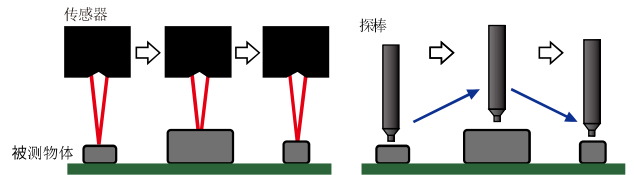


被测物体照片和测定结果图分别显示在左右区域中,也可以3D数据图的形式输出。照片下方是电磁感受性试验时的电磁波入侵路径的可视化。



自动化装置、软件和探棒全部是我公司自行研发!

通过对经过长年研发高可靠性自动化装置、高分辨率视频相机和高精度激光测距仪的组合,实现了高效紧凑的测试。使用了我公司自行研发的多种磁界、电界探棒,使满足实际用途的广频宽、高分析能力的测试成为可能。



通过激光测距仪传感器,不用接触被测物体即可对被测物体的形状进行测定(左)。而且,即使是对高度不同的物体的表面,也可实现等高·高灵敏度的正确的干扰测试试验(右)

WM7400 仕様

测定范围	W300mm×D215mm×H100mm (相机拍摄范围、A4纸大小)
测定方法	近磁界探棒扫描式 (付激光测距仪)
位置精度 (X、Y、Z)	±0.01mm (单方向移动的情况)
位置精度 (θ)	±1.0°
测定频率范围	150kHz~3GHz (标准) / 150kHz~8.0GHz (Opt.150K8G)
最小扫描精度	0.1mm
外观尺寸	W490mm×D709mm×H620mm (不含接头等突起处)
重量	约40Kg以下 (裸机、不含频谱仪和电脑)
输入电压	AC100V~240V
最大消耗电压	150VA (MAX)(不含频谱仪)

WM7400 相应探棒,请参照其他目录。



在正确的EMC试验中、屏蔽箱和电波暗箱等是必要的。上图为我公司生产的WM7400专用屏蔽箱。(另售)

生产厂家



森田テック株式会社

〒206-0804

東京都稲城市百村 2113-4

TEL: 042-401-6330 FAX: 042-401-6331

e-mail: info@morita-tech.co.jp HP: www.morita-tech.co.jp

销售代理店